

1. Record Nr.	UNINA9910713497103321
Autore	Schemmel Peter J.
Titolo	Microwave photoelasticity : a resonant wavelength approach applied to PEEK polymer // Peter J. Schemmel and Seth W. Waldstein
Pubbl/distr/stampa	Cleveland, Ohio : , : National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center, , March 2020
Descrizione fisica	1 online resource (12 pages) : color illustrations
Collana	NASA/TM ; ; 2020-220499
Soggetti	Polymers PEEK Nondestructive tests Photoelasticity Materials tests
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"March 2020."
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references (pages 11-12).